
**Surface chemical analysis —
Secondary-ion mass spectrometry —
Method for depth calibration for silicon
using multiple delta-layer reference
materials**

*Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions
secondaires — Méthode pour l'étalonnage de la profondeur pour le
silicium à l'aide de matériaux de référence à couches delta multiples*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn